⑷　４⑼の場合は、結果の平均電力が大きい方から３波について、周波数とともにnW／30kHz単位で記載する。上位２波が250nW／30kHz以下であり、かつ、３波目が0.06nW／MHz以下の場合は、結果を「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。

⑸　⑵又は⑷のいずれかが「良」となった場合は、副次発射の結果を「良」と記載する。

６　その他

⑴　スペクトル分析器の感度が足りない場合は、低雑音増幅器等を使用する。

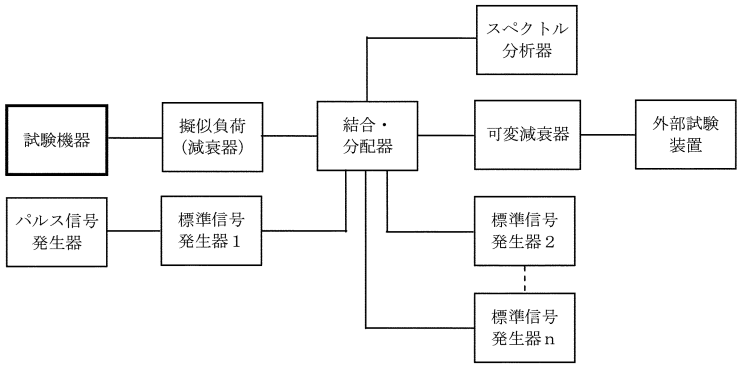
⑵　スペクトル分析器のＹ軸スケールの絶対値を、高周波電力計及び信号発生器を使用して確認する。

⑶　スペクトル分析器の検波モードの「サンプル」の代わりに「ＲＭＳ」を用いることができる。

⑷　試験機器の設定を連続受信状態にできないものについては、試験機器の間欠受信周期を最短に設定して測定確度が保証されるように、スペクトル分析器の掃引時間を、少なくとも１サンプル当たり１周期以上とする必要がある。

十三　キャリアセンス機能

１　測定系統図



２　測定器の設定等

⑴　標準信号発生器を次のように設定する。

信号周波数	試験機器の送信周波数帯の中心周波数等（注１）（注２）
変調	無変調
出力レベル	キャリアセンス動作を確認するに十分な値（注１）（注２）

⑵　スペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数	1,899.75MHz
掃引周波数幅	10MHz
分解能帯域幅	100kHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の３倍程度
Ｙ軸スケール	10dB／Div
トリガ条件	フリーラン
検波モード	ポジティブピーク

⑶　パルス信号発生器を次のように設定する。

ア　注１の周波数の場合

標準信号発生器１の出力を15msオフとし４ｓ以上オンとする信号

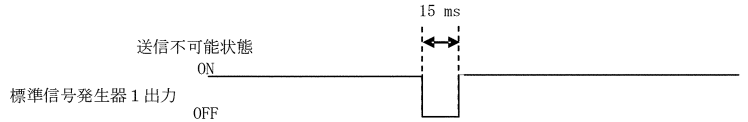


図１　標準信号発生器１の出力

イ　注２の周波数の場合

標準信号発生器１の出力を150ms周期で625μｓオンとする信号（親機であって、1,897.344MHz、1,899.072MHz、1,900.800MHzの周波数を送信する場合の標準信号発生器１の出力）

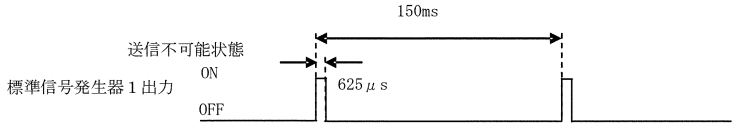


図２　標準信号発生器１の出力

⑷　外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、回線接続の確認ができる機能を有するものとする。ただし、外部試験装置の代わりに試験機器と通信可能な対向器を使用することができる。

⑸　可変減衰器の減衰量は、試験機器と外部試験装置が回線接続できる適正な値に設定する。

３　試験機器の状態

⑴　試験周波数で、最初に受信状態に設定する。

⑵　４に示す状態に設定する。

⑶　送信周波数を試験周波数とする。

４　測定操作手順

⑴　スペクトル分析器の設定を２⑵とする。

⑵　標準信号発生器の設定を２⑴とする。

⑶　標準信号発生器１の出力をオフの状態で、試験機器を送信動作とし、スペクトル分析器で電波を発射することを確認する。

⑷　試験機器を受信状態とする。

⑸　標準信号発生器１の出力を図１の状態で、試験機器を送信動作とし、スペクトル分析器で電波を発射しないことを確認する。

⑹　親機であって、1,897.344MHz、1,899.072MHz、1,900.800MHzの周波数を送信する場合は、発射する周波数の全てについて、標準信号発生器１の周波数を1,898.45MHz、1,900.25MHzとして、それぞれについて⑺から⑾までの試験を行う。

⑺　スペクトル分析器を２⑵の設定とする。

⑻　標準信号発生器を２⑴の設定とする。

⑼　標準信号発生器１の出力をオフの状態で、試験機器を送信動作とし、スペクトル分析器で電波を発射することを確認する。

⑽　試験機器を受信状態とする。

⑾　標準信号発生器１の出力を図２の状態で、試験機器を送信動作とし、スペクトル分析器で電波を発射しないことを確認する。

５　試験結果の記載方法